

Образец с атомно-молекулярным калиброванным рельефом для коррекции измерений в нанодиагностике

Определение линейных размеров высот в субнанометровом диапазоне



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Атомно-силовая микроскопия
- Электронно-зондовая микроскопия

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высота ступеней является параметром кристаллической структуры, значение которого известно, поэтому искажения, связанные с взаимодействием других сил (ван-дер-ваальсовых, кулоновских и пр.), могут быть учтены

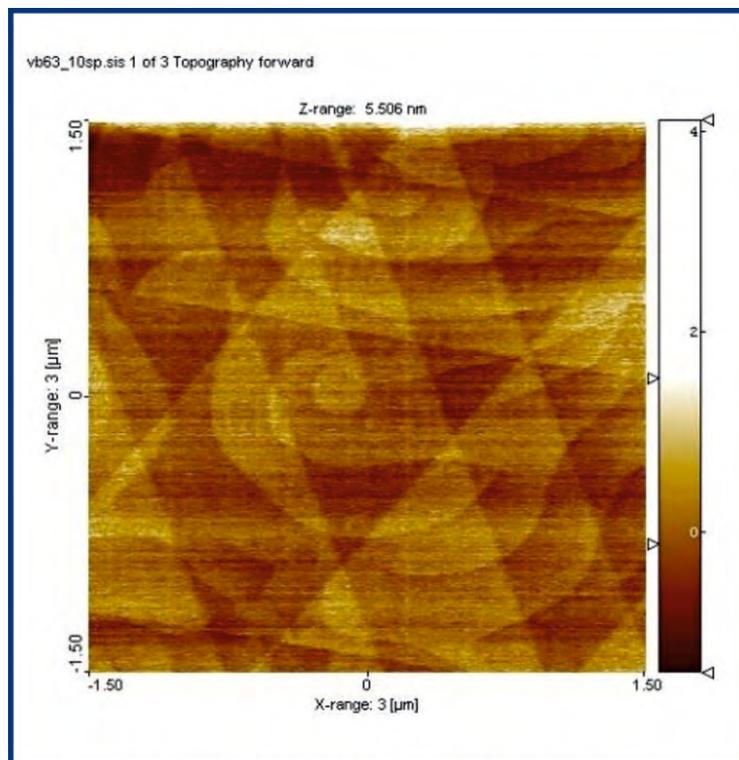
СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

Изготовлен макет на основе теллурида свинца

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калиброванные значения высот выступов на поверхности:

- 0,375 нм
- 0,75 нм
- 1,125 нм
- 1,5 нм
- 1,875 нм



Общий вид макета образца теллурида свинца с калиброванной высотой 0,375 нм и 0,75 нм

Центр трансфера технологий
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»





СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

***Больше научно-технических разработок
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на сайте***



***Сайт: ctt.etu.ru E-mail: ctt@etu.ru
Телефон: +7(812) 234-24-84
197022, Россия, Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, д.5 литера Ф***

НАУКА
И УНИВЕРСИТЕТЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ